

УДК 669.715:539.2.23:53.072

**В.Г. Ткаченко, Л.Р. Шагинян, А.И. Кондрашев,  
В.Л. Бекенев, А.А. Лисенко, В.В. Картузов**

Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины  
г. Киев, ул. Кржижановского, 3, Украина, 03680

## НАНОСТРУКТУРНЫЕ ЭМИССИОННО-АКТИВНЫЕ СПЛАВЫ АЛЮМИНИЯ ДЛЯ СИЛЬНОТОЧНЫХ ФОТОКАТАДОВ С ЛАЗЕРНЫМ ВОЗБУЖДЕНИЕМ

**Ключевые слова:** магнетронное распыление, металлические пленки, твердый раствор, электронная структура, нанокластер

В неравновесных условиях магнетронного распыления обнаружен эффект растворимости бария (до 2 ат.%) в ГЦК-решетке алюминия. Плотность наночастич в пленке составляет  $\sim 10^{12}$  см $^{-2}$ . Первопринципными методами рассчитана электронная структура твердого раствора Al-Ba. Результаты вычислений *ab initio* предсказывают гибридизацию атомных орбиталей Al и Ba посредством перекрытия электронных *s*-, *p*-, *d*-состояний Al и *d*-состояний Ba. Дополнительные вычисления *ab initio* электронной структуры атомных группировок с использованием теории функционала электронной плотности доказывают принципиальную возможность существования в твердом растворе Al-Ba нанокластера  $Al_{18}Ba_9$ , структура которого близка к структуре  $Al_xBa$ . Картины электронной микродифракции и данные оже-спектроскопии доказывают образование нанокластеров  $Al_mBa_n$  в сплавах Al-Ba и Al-Ba,Li.

### Введение

Электронный инжектор с фотокатодом, управляемым короткоимпульсным лазером, является ключевым компонентом ВЧ-ускорителей, способных формировать высокоплотные электронные пучки с высокой яркостью ( $10^9$ – $10^{11}$  А·см $^{-2}$ ·рад $^{-2}$ ), малым эмиттансом (0,6 мм·рад) и токоотбором (от 100 до 3000 А·см $^{-2}$ ).

Однако низкий квантовый выход, присущий металлам, в частности Mg с гексагональной плотноупакованной решеткой (ГПУ), Al и Cu с гранецентрированной кубической решеткой (ГЦК), в УФ-области спектра ( $10^{-5}$ ... $10^{-4}$  электронов/фотон) считается одним из основных недостатков, сдерживающих использование металлических фотокатодов с лазерным (ультрафиолетовым) возбуждением в ускорительной и лазерной технике.

Были предприняты отдельные попытки увеличения квантового выхода фотоэмиссии при оптическом возбуждении металлических атомных нанокластеров Me<sub>n</sub>, т. е. группировок, состоящих из n одинаковых атомов, в частности, атомов серебра [2]. Обсуждается механизм квантового выхода, определяемого по времени пролета методом масс-пролетной спектроскопии, для свободных (изолированных) металлических кластеров Ag<sub>n</sub> (размером 5,4 нм), которые

© В.Г. ТКАЧЕНКО, Л.Р. ШАГИНЯН,  
А.И. КОНДРАШЕВ, В.Л. БЕКЕНЕВ,  
А.А. ЛИСЕНКО. В.В. КАРТУЗОВ, 2010

получены синтезом в водно-солевых растворах с ПАВ и при химическом восстановлении водорода [3, 4]. Теоретические модели [5] предполагают образование оболочечной электронной структуры атомных (щелочных) нанокластеров  $\text{Na}_n$  и  $\text{K}_n$ , которые определяются «магическими» числами  $n = 8, 20, 40\dots$ . В этом случае с использованием первопринципных вычислений электронной структуры (*ab initio density functional theory methods*) и масс-пролетной спектроскопии удается определить «магические» числа и силы связи, характеризующие стабильность этих атомных группировок (докритических размеров). Электронная оболочка валентных электронов усиливает стабильность металлического атомного кластера. Однократно заряженные кластеры щелочноземельных металлов ( $\text{Mg}$ ,  $\text{Sr}$ ,  $\text{Ba}\dots$ ) обладают добавочным (нечетным) числом валентных электронов и поэтому содержат открытые оболочки, которые отличаются близостью энергии Ферми к минимуму на кривой плотности состояний. К сожалению, в периодической литературе при анализе атомных кластеров, например  $\text{Mg}_{13}$  в ГПУ- $\text{Mg}$ ,  $\text{Al}_{16}$  в ГЦК- $\text{Al}$ ,  $\text{Be}_{19}$  в ГПУ- $\text{Be}$  и т. д.), кластерный подход используется только для моделирования части массивного кристалла как фрагмента кристаллической решетки, а также для исследования специфических особенностей малых частиц [6–8].

На современном этапе развития сильноточной фотоэлектроники появилась возможность формировать смешанные (легированные) нанокластеры, которые состоят из разнородных атомов, встроенных в кристаллическую решетку матрицы-растворителя в естественных технологических условиях. Легирование атомных кластеров повышает их химическую инертность и стабильность, а также изменяет их электронные и физико-химические свойства, что является принципиально важным для синтеза наносистем по механизму сборки [9]. По современным представлениям,  $N$ -атомный нанокластер – это молекула с  $3N$  степенями свободы, где  $N$  – число атомов в кластере. Из-за влияния поверхности решетка кластера не является строго периодической и характеризуется меньшей

длиной химической связи по сравнению с массивными кристаллами [2, 5].

В предыдущих исследованиях [10, 11, 12] впервые установлена надежная корреляция между повышением плотности состояний вблизи уровня Ферми и увеличением квантового выхода для биметаллических систем сплавов  $\text{Mg}-\text{Ba}$  и  $\text{Al}-\text{Li}$ . Кроме того, предложен физический подход в фотоэлектронике металлических кристаллов, который сводится к изучению формирования в металлических системах сплавов биметаллических кластеров с собственной электронной структурой и гибридной химической связью [12]. Такой подход обеспечивает решение физической проблемы повышения квантовой эффективности фотоэмиттеров (для инжекторов электронов) на основе кардинального (на 2–4 порядка измеряемой величины) увеличения низкого квантового выхода металлов ( $\text{Mg}$ ,  $\text{Cu}$ ,  $\text{Y}$ ), перспективных для использования в сильноточной электронике. Важно подчеркнуть, что спектральное распределение плотности электронных состояний, вычисленное FLAPW-методом для биметаллического нанокластера  $\text{Mg}_{16}\text{Ba}_2$ , практически совпадает с экспериментальным распределением плотности состояний по данным УФ-фотоэлектронной спектроскопии для объемного сплава  $\text{Mg} - 2,1\% \text{ Ba}$ . При этом максимальный квантовый выход фотоэмиссии достигает значений до  $10^{-2}$  электронов/фотон при плотности нанокластеров  $10^{10} \text{ см}^{-2}$  [13].

Наблюдается зависимость квантовой эффективности наносистем от плотности упаковки кластеров, встроенных в структуру твердого раствора [13, 14].

Основными целями работы являются:

1) выяснение принципиальной возможности кластеризации и моделирование различных атомных группировок нанокластеров на основе теоретического анализа электронной структуры и ожидаемой корреляции между плотностью состояний на уровне Ферми и квантовым выходом фотоэмиссии для сплавов  $\text{Al}-\text{Ba}$ ;

2) отработка методики ионно-кластерного осаждения для получения более высокой плотности упаковки нанокластеров  $\text{Al}_m\text{Ba}_n$  (на

уровне  $10^{10}$ – $10^{12}$  см $^{-2}$ ), обеспечивающей дальнейшее повышение квантовой эффективности наносистем.

В качестве легирующей добавки выбран кластерообразующий элемент Ва, который обеспечивает повышенный квантовый выход фотоэмиссии Al в УФ-области спектра [15] и способен увеличивать локальную плотность состояний на уровне Ферми за счет собственной электронной структуры нанокластера [12].

## Методология

### Теоретические расчеты электронной структуры

В последние годы в связи с увеличением вычислительных возможностей персональных компьютеров резко возросла роль расчетов *ab initio* при проведении исследований в области физики твердого тела. Постепенно расчеты на основе первых принципов вытесняют полуэмпирические методы, которые опираются на большее число подгоночных параметров. Наблюдается тенденция к расширению сферы применения точных квантово-механических методов расчета электронной структуры и физических свойств твердых тел. В последнее время такие методы (в частности метод FLAPW – линеаризованный метод присоединенных плоских волн с общей формой потенциала) все чаще применяются при решении не только фундаментальных (интерпретация численных экспериментальных данных), но и прикладных задач.

Повышение точности методов *ab initio*, совершенствование вычислительной техники позволяют сегодня выполнять высокоточные расчеты межатомных взаимодействий и параметров ближнего порядка в сложных соединениях и сплавах, что дает возможность перейти к решению ряда важных прикладных задач материаловедения, таких, как анализ свойств существующих и разрабатываемых материалов. Вычислительный эксперимент, который основан на подобных расчетах (например различные виды *ab initio* молекулярной динамики), позволяет целенаправленно проводить разработку новых материалов.

Теоретико-познавательная ситуация усложняется при исследовании биметаллических нанокластеров, состоящих из разносортных атомов. Особенностью этих атомных группировок, встроенных в структуру массивного металла, являются гибридизация атомных орбиталей и изменение химической связи. Расчет электронной структуры нанокластера из первых принципов (методом FLAPW) предсказывает гибридизацию атомных орбиталей посредством перекрытия, например, *s*-, *p*-состояний Mg и *d*-состояний Ва [13, 14]. В условиях неравновесной объемной кристаллизации сплавов образование более прочной химической связи объясняется формированием собственной электронной структуры кластера, ответственной за повышение локальной плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми. Однако ГПУ-Mg и другие металлы II группы (Ca, Zn...) являются металлами, не имеющими *d*-состояний на уровне Ферми, и поэтому образуют самостоятельную группу в теории химической связи металлических сплавов.

Расчет электронной структуры алюминия и сплава Al-Va проведен методом линеаризованных присоединенных плоских волн с помощью программного комплекса «Wien-97» [16]. Для обменно-корреляционного потенциала использовалось обобщенно-градиентное приближение Педью–Бурке–Эрзенхофа [17]. Итерации самосогласованного расчета проводили с использованием 250 точек в неприводимой части зоны Бриллюэна. После достижения самосогласования для расчета плотности состояний была проведена дополнительная итерация с использованием 800 точек в неприводимой части зоны Бриллюэна.

Для моделирования сплава Al-Va была построена суперячейка ГЦК-структуры, параметр которой равен удвоенному параметру ГЦК-Al. Такая ячейка содержит 32 атома алюминия. Сплавы системы Al-Va моделировались путем замены одного или двух атомов алюминия в суперячейке на атомы бария. Замена одного атома Al на атом Ва соответствует сплаву Al-Va с атомной концентрацией бария 3,12%. При замене двух атомов Al на атомы Ва концентрация бария возрастает до 6,25 ат.%. Первую модельную структуру будем обозначать символом Al<sub>31</sub>Va, вторую – Al<sub>30</sub>Va<sub>2</sub>.

Кроме того, были проведены расчеты электронной структуры малых кластеров с помощью программного комплекса «Gaussian-98» в рамках теории функционала электронной плотности (DFT) и с использованием специального базиса LanLMB, предназначенного для расчетов систем из тяжелых атомов. В этом приближении основные состояния рассматривались как атомные, а полуостовные были включены в расчеты валентных состояний. Достигалось самосогласование в полной энергии до  $0,7 \cdot 10^{-4}$  атомных единиц энергии после 20–35 итераций. Были рассмотрены две модели кластеров. В первой кластер состоял из последовательности трех элементарных ГЦК-кубиков алюминия, в которой два атома центрального кубика замещались на атомы бария. Во второй модели кластер представлял собой элементарную область кристаллической структуры  $\text{Al}_4\text{Ba}(\text{D}1_3)$  [18].

### Техника эксперимента

Сплав алюминия (A99) с 5 масс.% бария (99,99% Ba) был получен в индукционной печи в среде аргона (рабочий газ). Из слитка были изготовлены мишени  $\varnothing 50 \times 4$  мм. Для напыления углеродных пленок применяли ядерный графит. В качестве подложки использовали монокристаллический кремний. Подложку обезжиривали, удаляли оксидный слой, промывали в дистиллированной воде и сушили. Формирование пленок проводили методом магнетронного распыления с помощью модернизированной установки УВН-2М с кольцевым постоянным магнитом. Углеродную пленку напыляли при  $P_{Ar} = 10$  Па, токе разряда 2 А, напряжении 576 В на расстоянии мишень–подложка 40 мм. Пленку из сплава алюминия с барием напыляли при  $P_{Ar} = 0,8$  Па, токе разряда 0,4–0,5 А, напряжении 650 В. Исследование кристаллической структуры конденсаторов проводили с помощью сканирующего электронного микроскопа «Camebax» с приставкой-анализатором SX-200 и электронографа EMP-100. Оже-электронную спектроскопию пленок из сплава алюминия с барием проводили с помощью оже-микрозонда JAMP-10S фирмы «Jeol» с диаметром зонда в

интервале 1–10 мкм и глубиной анализируемой области 10–20 Å. Поверхность свежеприготовленных пленок подвергали ионной бомбардировке. Регистрировали низкоэнергетические пики оже-электронных спектров (LVV-переходы) для исходного (литого) состояния алюминия и алюминия исследуемых пленок.

Катоды с шероховатостью на микронном уровне характеризуются более высокими фотомиссионными свойствами по сравнению с катодами с плоской поверхностью [19]. Кроме того, шероховатая поверхностьnanostructuredированной пленки обеспечивает повышенную плотность упаковки частиц. Поэтому пленки из сплава алюминия с барием формировали не на гладкой поверхности кремния, а на предварительно напыленной на него углеродной пленке.

### Результаты исследований

Углеродные пленки, сформированные методом магнетронного распыления, имеют характерную столбчатую структуру [20]. На поверхности такой пленки образуются обычно сферолитоподобные частички углерода. Al-Ba-пленки были изготовлены в камере непосредственно (*in situ*) конденсацией сплава на углеродных пленках, осажденных на Si-подложках. Толщина пленки из сплава Al с Ba составляет ~150 нм. Ее поверхностный рельеф повторяет рельеф углеродной пленки (рис. 1 $a$ ,  $b$ ), т. е. она является шероховатой на микронном уровне.

Для дифракции электронов верхний предел размера нанокристаллов, дающих кольцевую картину, составляет 10–100 нм. Пленка из сплава Al с Ba состоит из поликристаллов, средний размер которых не превышает 20–50 нм. Плотность упаковки этих частиц ( $10^{11}$ – $10^{12}$  см $^{-2}$ ) на 1–2 порядка превышает плотность наночастичек (кластеров) – эмиссионно-активных центров, полученных методом неравновесной объемной кристаллизации и обеспечивающих высокий квантовый выход фотоэмиссии в УФ-области спектра ( $Y \approx 10^{-3}$  электронов/фотон при  $h\nu = 4,9$  эВ) [10, 11, 21]. Микрорентгеноспектральный анализ конденсата показывает, что он содержит 98 ат.% Al и 2 ат.% Ba. По данным

электронографического анализа, он является твердым раствором бария в алюминии.

Важной особенностью оже-электронной спектроскопии является чувствительность оже-перехода к химической природе взаимодействия анализируемых элементов. Это взаимодействие

отражается на спектрах оже-электронов в виде химических сдвигов [22, 23]. Низкоэнергетические (основные) пики алюминия в оже-спектре чистого Al и Al в оже-спектре наноструктурированной пленки из сплава с барием, который соответствует LVV-переходу, приведены на рис. 2.

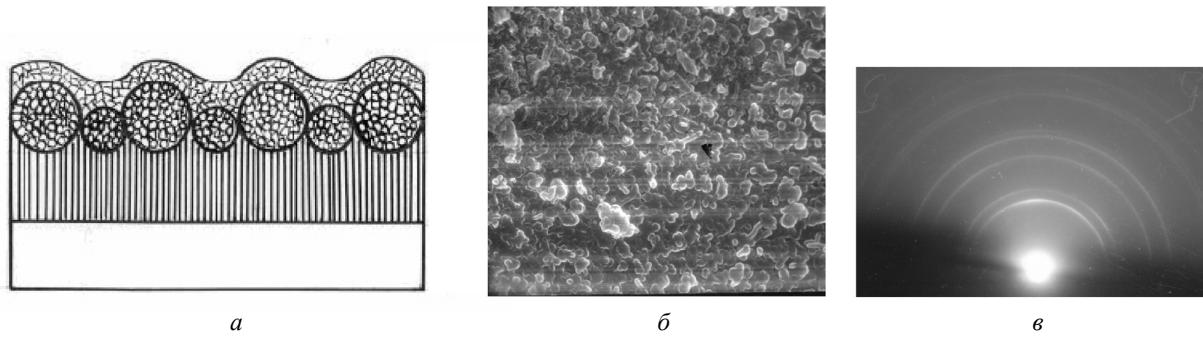


Рис. 1. Структура пленки сплава Al-Ba на углеродной подложке: схематическое изображение поперечного разреза (а), снимок поверхности рельефа (б) и электронограмма пленки (в)

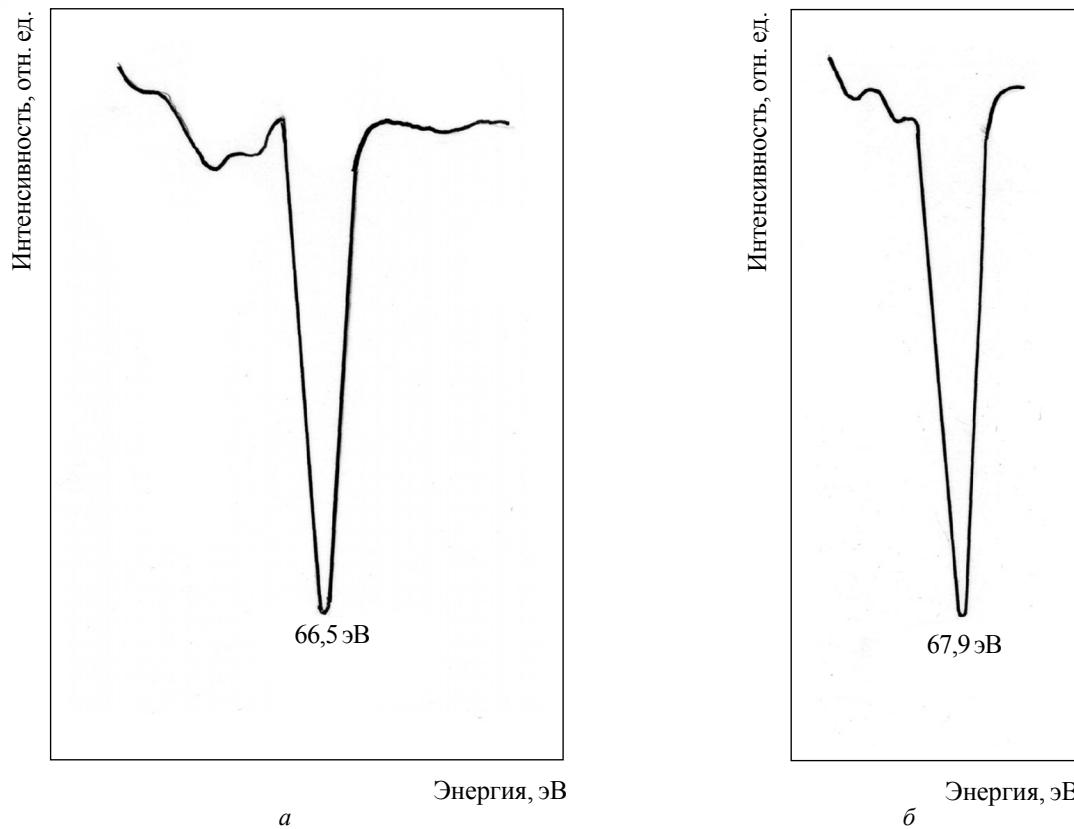


Рис. 2. Низкоэнергетический пик Al, соответствующий LVV-переходу: в оже-спектре алюминия (а); в оже-спектре наноструктурированной пленки сплава Al-Ba (б)

Обнаружен химический сдвиг основного пика Al в пленке относительно такого же пика для чистого алюминия. Это свидетельствует о химическом взаимодействии между атомами алюминия и бария. Очевидно, происходит перераспределение плотности электронных состояний алюминия при растворении бария.

Сведения о распределении плотности электронных состояний алюминия и твердого раствора бария в нем можно получить путем расчета их электронной структуры, из которого следует, что замещение части атомов алюминия на атомы бария приводит к появлению особенностей на кривой плотности электронных состояний; с повышением концентрации бария в твердом растворе повышается значение плотности состояний  $N(E)$  на уровне Ферми (рис. 3). Для установления природы этого эффекта были рассчитаны парциальные плотности электронных состояний алюминия и бария в чистом алюминии и модельных структурах. Результаты расчетов приведены на рис. 4. Они позволяют сделать вывод о том, что описанный выше эффект происходит вследствие гибридизации  $s$ -,  $p$ -,  $d$ -состояний алюминия с  $d$ -состояниями бария.

Результаты расчетов полных плотностей электронных состояний в моделях кластеров представлены на рис. 5. Для интерпретации полученных результатов полезно рассмотреть состояния изолированных атомов Al и Ba. В соответствии с атомными расчетами, приведенными в работе [24], эти атомы имеют такие валентные состояния:

$$\begin{aligned} \text{Al } (Z=13) \text{ E}(2s^2) &= -0,78684 \text{ Ry}, \\ \text{E}(3p^1) &= -0,41990 \text{ Ry}; \\ \text{Ba } (Z=56) \text{ E}(6s^2) &= -0,31505 \text{ Ry} \end{aligned}$$

Можно ожидать, что валентная полоса формируется  $2s^2$ - и  $3p^1$ -электронами алюминия и  $6s^2$ -электронами бария. При этом полуостровные состояния атома бария удалены от валентной полосы на 28 эВ, т. е. их влияние на нее представляется несущественным. Сравнение величин энергии электронов в свободных атомах показывает, что электроны атомов Ba значительно влияют на прифермьевскую область.

## Обсуждение результатов

Первопринципный FLAPW-метод вычисления электронной структуры предсказывает повышение плотности состояний на уровне Ферми в системе Al-Ba при увеличении концентрации бария. Новые результаты исследований указывают на важную особенность кристаллической структуры твердого раствора: она получена в условиях, далеких от термодинамического равновесия несмешивающихся систем (so called immiscible systems), таких, как Al-Ba, поскольку магнетронное распыление расширяет пределы растворимости систем с ничтожной взаимной растворимостью компонентов [25].

Сравнительный анализ электронных состояний в кластерных моделях трех кубов и структуры  $\text{Al}_4\text{Ba}$  указывает на принципиальную возможность формирования нанокластеров внутри твердого раствора Al-Ba с расширенным пределом растворимости.

**A. Кластерная модель трех кубов** (рис. 5 $a$ - $c$ ). На рис. 5 $a$  приведен кластер со структурой ГЦК-Al из 32 атомов. В случае кластера  $\text{Al}_{30}\text{Ba}_2$  два атома Al – средние в третьем и пятом слоях – заменены атомами бария. В расчетах кластерной модели малое количество атомов приводит к появлению пиков, но огибающая кривая дает параболу. Валентная полоса охватывает область энергий приблизительно в 10,5 эВ. Замещение внутренних атомов алюминия атомами бария влияет на форму кривой как в низкоэнергетической области, так и в прифермьевской (рис. 5 $b$ ,  $c$ ). При этом уровень Ферми находится вблизи максимума, появление которого обусловлено взаимодействием состояний Al {3p $^1$ } и Ba {6s $^2$ }. Величина плотности электронных состояний на уровне Ферми возрастает по сравнению с кластером, состоящим только из атомов Al (рис. 5 $b$ ). Согласно этой модели, в формировании структуры валентной полосы участвуют, вероятнее всего, внешние электроны атомов алюминия, а электроны примесных атомов влияют преимущественно на прифермьевскую область.

**B. Кластерная модель структуры  $\text{Al}_4\text{Ba}$**  (рис. 5 $d$ - $e$ ). На рис. 5 $d$  приведен кластер со

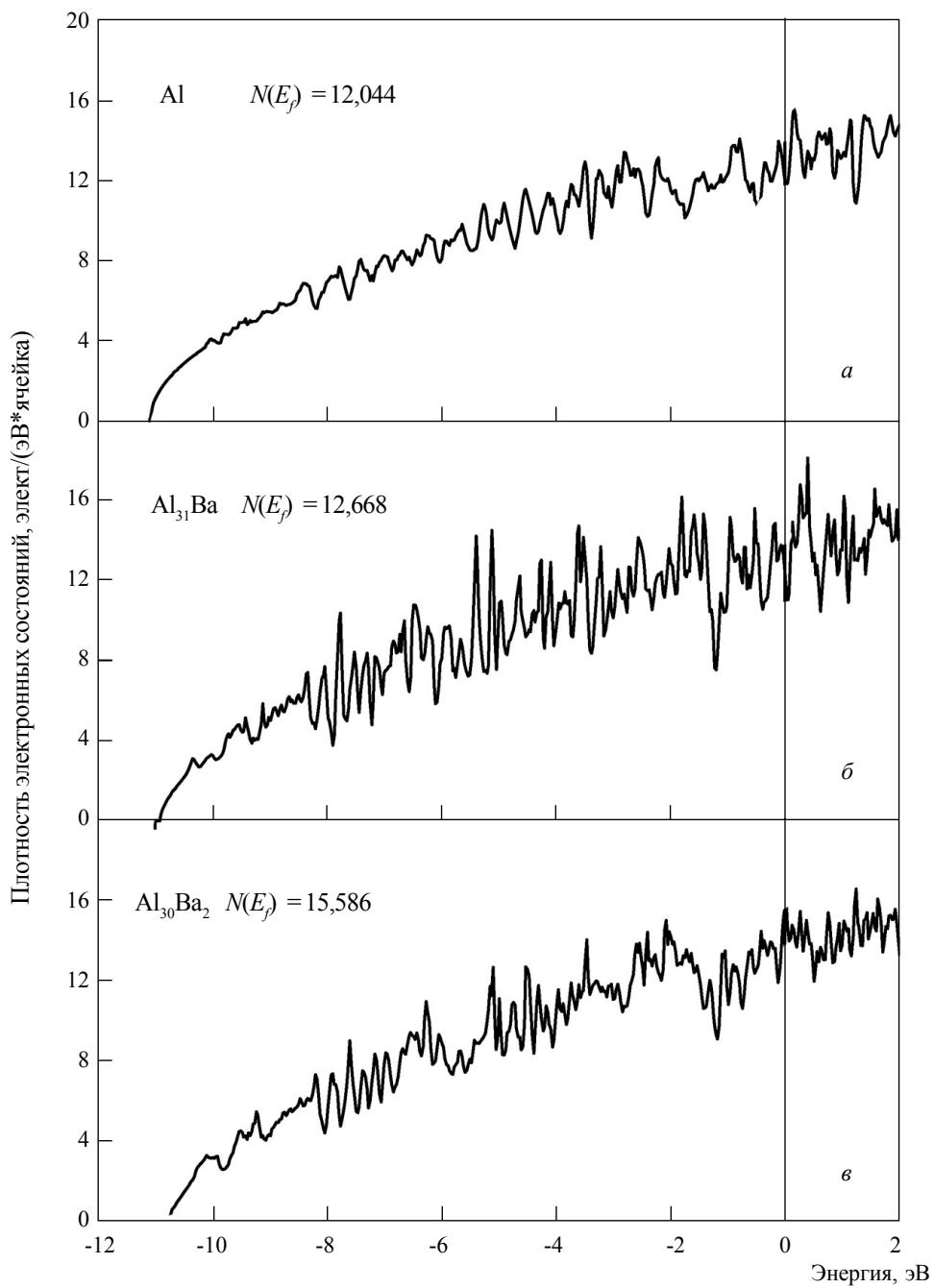


Рис. 3. Полная плотность электронных состояний в ГЦК-структуре Al ( $a$ ) и модельных структурах  $\text{Al}_{31}\text{Ba}$  ( $\sigma$ ),  $\text{Al}_{30}\text{Ba}_2$  ( $\epsilon$ ). Ноль совмещен с уровнем Ферми

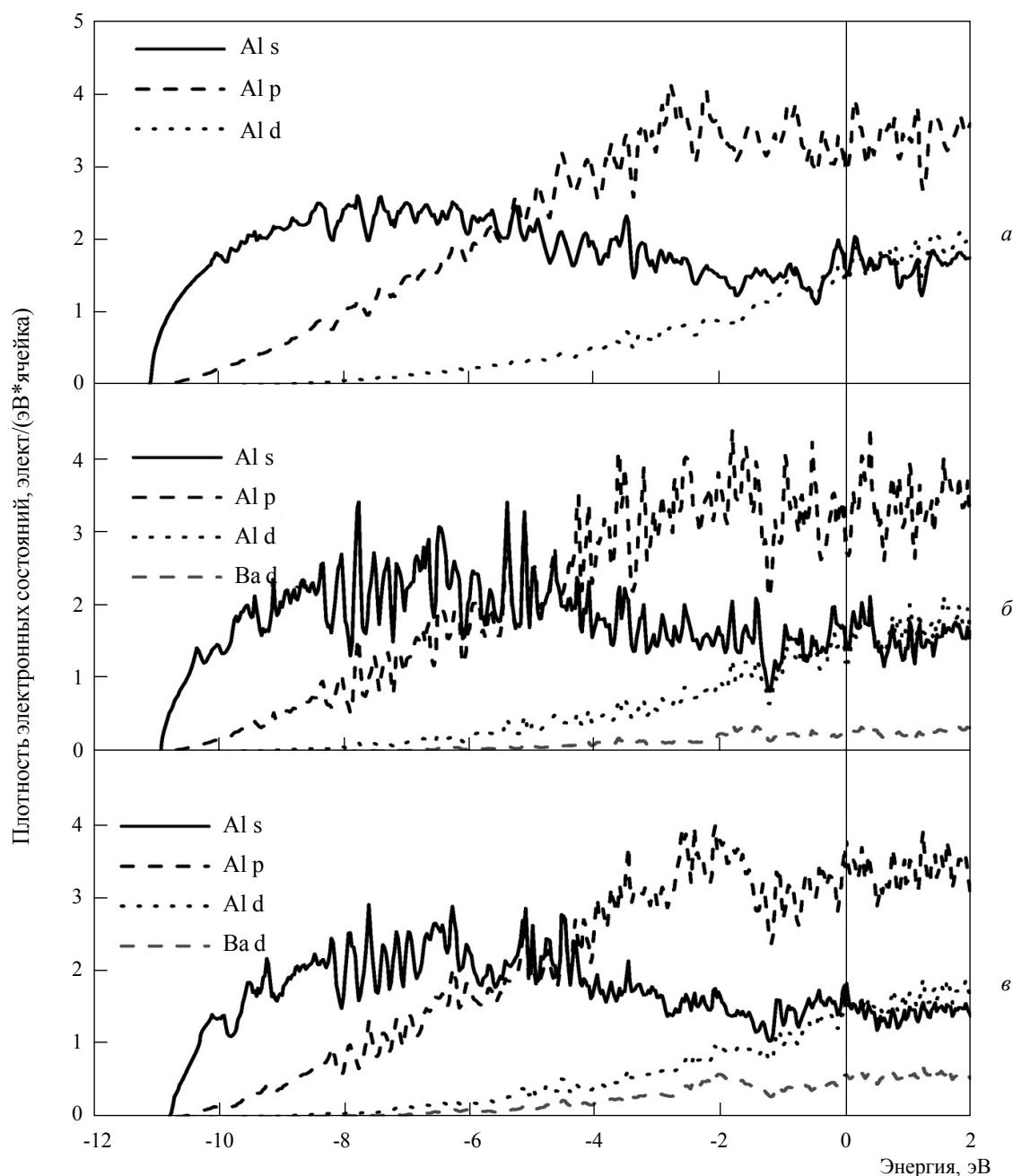


Рис. 4. Парциальные плотности электронных состояний для кристаллического Al (*a*) и модельных структур  $\text{Al}_{31}\text{Ba}$  (*b*),  $\text{Al}_{30}\text{Ba}_2$  (*c*). Ноль совмещен с уровнем Ферми

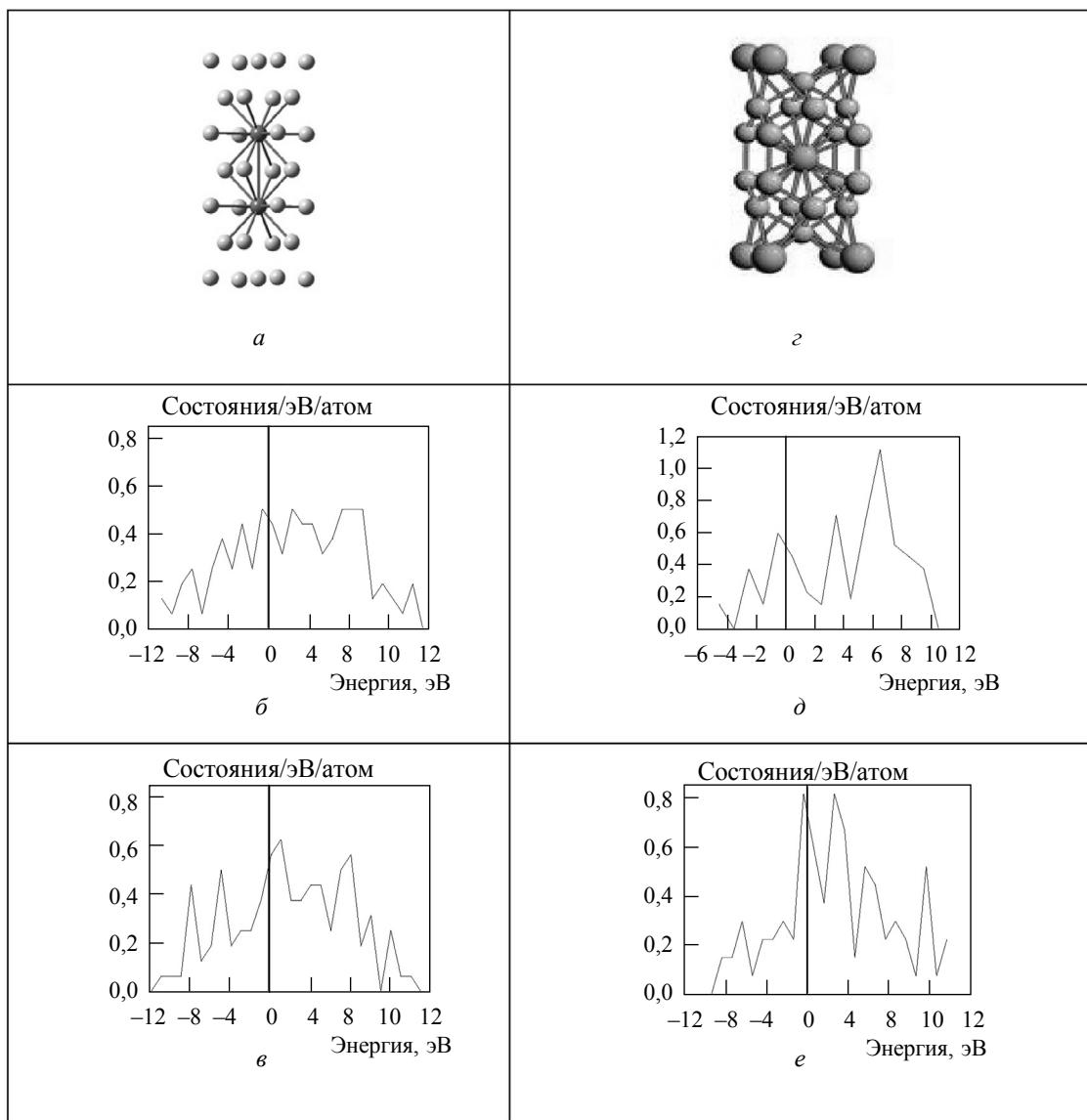


Рис. 5. Полная плотность электронных состояний кластеров Al<sub>32</sub> (*б*), Al<sub>30</sub>Ba<sub>2</sub> (*в*) со структурой ГЦК-Al (*а*), Al<sub>27</sub> (*д*), Al<sub>18</sub>Ba<sub>9</sub> (*е*) со структурой Al<sub>4</sub>Ba (*г*)

структурой Al<sub>4</sub>Ba. Здесь атомы Ba больше по размеру, чем атомы Al. В этих кластерах соотношение атомов алюминия и бария иное, чем в модели трех кубов. Кластер содержит 18 атомов алюминия и 9 атомов бария. Прифермиевская область имеет вид «оврага»: уровень Ферми для кластера Al<sub>18</sub>Ba<sub>9</sub> лежит почти на максимуме (рис. 5*e*). Плотность состояний

для кластера, содержащего только атомы алюминия, приведена на рис. 5*d*. Значительное изменение прифермиевской области на кривых плотности электронных состояний для кластеров Al-Ba (рис. 5*e*) по сравнению с кластером Al<sub>27</sub> (рис. 5*d*) должно привести к изменению оптических и эмиссионных свойств этих кристаллов.

Анализ литературных данных и полученных в этой работе экспериментальных и теоретических результатов позволяет сделать вывод о возможности значительного влияния малых концентраций примеси замещения на фотоэмиссионные свойства сплава в системе Al-Ba. Квантовый выход фотоэмиссии литого сплава Al – 3% Ba – 1% Li при  $h\nu = 4,9$  эВ составляет  $2,4 \cdot 10^{-3}$  электронов/фотон, что на 2–3 порядка превышает его значение для нелегированного алюминия [26]. Мы полагаем, что высокая квантовая эффективность фотокатодов, изготовленных из этого сплава, обеспечивается прежде всего нанокластеризованной структурой матричного твердого раствора. В объеме его находятся металлические кластеры Al-Ba с ГПУ-структурой с размерами 10–14 нм и плотностью упаковки  $\sim 10^{10}$  см $^{-2}$ . При этом картина электронной микродифракции является типичной для такого вида наночастиц (рис. 6). Физическая интерпретация «тяжей» (протяженных рефлексов увеличенных размеров), наблюдаемых на дифракционных картинах электронограмм, дана в монографии [27]. Образование доменов с такой же кристаллической структурой, как и матрица, или даже тонких выделений, ко-герентных с матрицей, связывается с растяже-

нием узлов обратной решетки. Данный эффект эквивалентен физическому уширению линий на рентгенограммах дисперсных кристаллов. Это означает, что наночастицы следует отнести к категории структурных единиц кластерного происхождения, т. е. сформированных по кластерному механизму до размеров, достаточных для идентификации их по картинам электронной дифракции.

## Выводы

1. Квантово-механические расчеты теоретической плотности электронных состояний ГЦК-Al и модельных сплавов Al<sub>31</sub>Ba, Al<sub>30</sub>Ba<sub>2</sub> предполагают образование химической связи между матрицей Al и примесями замещения Ba. В соответствии с рассмотренной моделью гибридизации *s*-, *p*-, *d*-электронных состояний Al и *d*-состояний Ba увеличение концентрации растворенного бария приводит к повышению плотности электронных состояний вблизи уровня Ферми.

2. Сравнение результатов вычислений плотности состояний модельных нанокластеров с данными оже-электронной спектроскопии и картинами электронной микродифракции убеждает в том, что именно нанокластер Al<sub>18</sub>Ba<sub>9</sub> встраивается в решетку твердого раствора Ba в Al. В частности, обнаружение рефлексов нанокластера в рефлексах фазы стехиометрического состава (Al<sub>4</sub>Ba) свидетельствует о сходстве этих двух типов решеток.

3. Установлено, что в неравновесных условиях кристаллизации сплава Al с Ba, т. е. при формировании конденсата на подложке методом магнетронного распыления, в биметаллических сплавах Al-Ba растворяется 2 ат.% бария, тогда как в равновесных условиях Ba практически не растворяется в ГЦК-решетке Al.

4. Наноструктурированные пленки сплава Al с Ba имеют более высокое значение квантового выхода фотоэмиссии по сравнению с литыми крупнокристаллическими сплавами алюминия с барием вследствие повышенных значений плотности состояний  $N(E_f)$  твердого раствора бария в ГЦК-Al, более высокой плотности упаковки наночастиц, а также мик-

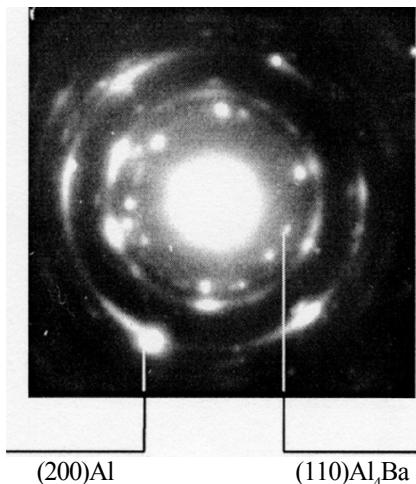


Рис. 6. Картина электронной микродифракции нанокластера из атомов Al и Ba со структурой Al<sub>4</sub>Ba (ГПУ), который находится в объеме матричного твердого раствора сплава Al – 3% Ba – 1% Li

рощероховатості их емітируючої поверхні. Поэтому они являются перспективными в качестве фотокатодов инжекторов электронов, формирующих импульсные электронные пучки высокой яркости и с малым эмиттансом.

У нерівноважних умовах магнетронного розпилення виявлено ефект розчинності барію (до 2 at.%) в ГЦК-решітці алюмінію. Щільність наночастинок у плівці становить  $\sim 10^{12}$  см $^{-2}$ . Першопринципними методами розраховано електронну структуру твердого розчину Al-Ba. Результати обчислень *ab initio* передбачають гібридизацію атомних орбіталей Al та Ba через перекривання електронних *s*-, *p*-, *d*-станів Al та *d*-станів Ba. Додаткові обчислення *ab initio* електронної структури атомних групувань із використанням теорії функціонала електронної щільності доводять принципову можливість існування у твердому розчині Al-Ba нанокластера  $\text{Al}_{18}\text{Ba}_9$ , структура якого близька до структури  $\text{Al}_4\text{Ba}$ . Картини електронної мікродифракції та дані оже-спектроскопії доводять утворення нанокластерів  $\text{Al}_m\text{Ba}_n$  у сплавах Al-Ba, Al-Ba,Li.

**Ключові слова:** магнетронне розпилення, металеві плівки, твердий розчин, електронна структура, нанокластер

The effect of barium solubility (up to 2 at.%) in aluminum was revealed in Al-Ba films with structure close to that of  $\text{Al}_4\text{Ba}$ . The films were deposited in nonequilibrium conditions of magnetron sputtering. The density of nanoparticles in film is  $\sim 10^{12}$  cm $^{-2}$ . Electron structure of Al-Ba solid solution was calculated based on *ab initio* principle. Results of calculations predict the hybridization of atomic orbitals of Al and Ba by overlapping of *s*-, *p*-, *d*-states of Al with *d*-states of Ba. Calculations of the electronic structure of atomic groups on the base of the density functional theory prove the possibility of the existence of  $\text{Al}_{18}\text{Ba}_9$  nanoclusters inside the Al-Ba solid solution. Investigations of crystal structure of Al-Ba-Li film alloy using electron diffraction and Auger-spectroscopy prove the formation of  $\text{Al}_m\text{Ba}_n$  nanoclusters in Al-Ba and Al-Ba-Li alloy films.

**Key words:** magnetron sputtering, metallic films, solid solution, electronic structure, nanocluster

1. Haimson J., Mecklenburg B., Stovell G. A fully demountable 550 kV electron gun for low emittance beam experiment with 17 GHz linac // Proc. of the Particle Accelerator Conference, Vancouver (Canada). – 1997. – 3. – P. 2808–2810.
2. Faraci G., Pennisi A.R. Mechanism of photoelectron yield enhancement from Ag clusters // Phys. Rev. – 1989. – 40, N 6. – P. 4209–4211.
3. Спирин М.Г., Бричкин С.Б., Разумов В.Ф. Особенности получения наночастиц золота анизотропной формы в обратных мицеллах тритона X-100 // Химия высоких энергий. – 2010. – 44, № 1. – С. 54–59.
4. Metal cluster enhanced organic solar cell / Westphalen M., Kreibig U., Rostalski J. et al. // Solar Energy Materials and Solar Cells. – 2000. – 61. – P. 97.
5. Kresin V.V. Electron distribution and collective resonance in nonspherical metal clusters // Phys. Rev. – 1992. – 45, N 24. – P. 14321–14327.
6. Петров Ю.И. Физика малых частиц. – М.: Наука, 1982. – 360 с.
7. Шпак А.П., Куницкий Ю.А., Карбовский В.Л. Кластерные иnanoструктурные материалы. – К.: Академпериодика, 2001. – 588 с.
8. Суздалев И.П., Суздалев П.И. Нанокластеры и нанокластерные системы. Организация, взаимодействие, свойства // Успехи химии. – 2001. – 70, № 3. – С. 203–240.
9. Mass Spectrometric and First principles study of  $\text{Al}_n\text{C}$ -clusters / Zhao J., Liu B., Zhai H. et al. // Solid State Commun. – 2002. – 122, N 10. – P. 543–547.
10. Электронная структура металлических сплавов с повышенным квантовым выходом фотоэмиссии / Ткаченко В.Г., Кондрашев А.И., Лазоренко В.И. и др. // Докл. РАН. – 1999. – 367, № 5. – С. 632–635.
11. Высокоэффективные фотоэмиссионные материалы на основе металлических систем, сплавов. Современное состояние, перспективы развития / Ткаченко В.Г., Максимчук И.Н., Кондрашев А.И. и др // М-лы междунар. конф. «Современное материаловедение, достижения и проблемы». – К., 2005. – С. 409–410.
12. Ткаченко В.Г., Кондрашев А.И., Максимчук И.Н. Физические основы фотоэлектроники металлических кристаллов. – К.: Академпериодика, 2009. – 219 с.
13. Tkachenko V.G., Kondrashev A.I., Maksimchuk I.N. Advanced metal alloy system for massive high-current photocathodes // Appl. Phys. B. Lasers and Optics. – 2010. – 98. – P. 839–849.
14. Ткаченко В.Г. Современные тенденции в физике легких металлов // Успехи физики металлов. – 2009. – 10. – С. 105–132.
15. А. с. № 1758704/1 СССР. Фотокатод, работающий в ультрафиолетовой области спектра / Бишаев А.М., Демидов Ю. В., Зусман Л. Л. и др. (СССР). – 4 с. Опубл. 30.08.1992; Бюл. № 32.
16. Blaha P., Schwarz K., Luitz J. A Full Potential Linearized Augmented PlaneWave Package for Calculating Crystal Properties // Techn. Universität Wien, Austria. – 1999. – 119 p.
17. Perdew J.P., Burke S., Ernzerhof M. Generalized Gradient Approximation Made Simple // Phys. Rev. Lett. – 1996. – 77, N 1. – P. 3865–3868.
18. Матюшенко Н.Н. Кристаллические структуры двойных соединений. – М.: Металлургия, 1969. – 302 с.

19. Урбах М.И. Влияние шероховатости эмитирующей поверхности на фотоэмиссионные свойства материалов // М-лы XX Всесоюз. конф. по эмиссионной электронике. – К., 1987. – Т. 2. – С. 158–160.
20. Hoffman D.W., McCune R.C. Microstructural control of plasma sputtered refractory coating // Handbook of Plasma Processing Technology. – Park Ridge, New Jersey: Noyes Publ. – 1990. – P. 473–497.
21. Физические принципы формирования фотоземиссионных свойств сильноточных импульсных фотокатодов с лазерным возбуждением на основе системы магний–барий / Трефилов В.И., Ткаченко В.Г., Максимчук И.Н. и др. // Докл. РАН. – 1995. – **340**, № 1. – С. 48–50.
22. Электронная и ионная спектроскопия твердых тел / Под ред. Л. Фирменса, Дж. Вэнника, В. Декейсера. – М.: Мир, 1981. – 468 с.
23. Черепин В.Е., Васильев М.А. Методы и приборы для анализа поверхности материалов. – К.: Наукова думка, 1982. – 400 с.
24. Mann J.B. Atomic Structure Calculations. II. Hartree-Fock Wavefunctions and Radial Expectation Values: Hydrogen to Lawrencium. – Los Alamos, 1968. – 125 p.
25. Childress J.R., Chien C.L. Reentrant magnetic behavior in fcc Co-Cu alloys // Phys. Rev. – 1991. – **43**, N 10. – P. 8089–8093.
26. Nanocluster-induced quantum photoyield of metal alloy systems / Tkachenko V.G., Kondrashev A.I., Maksimchuk I.N. et al. // Appl. Phys. B. Lasers and Optics. – 2010. – **101**. – P. 253–261.
27. Эндрюс К., Даисон Д., Куун С. Электронограммы и их интерпретация. – М.: Мир, 1971. – 256 с.